Search Notes			

Appl	ication	Control	No.

10/664,224

Examiner Jorge L. Ortiz-Criado

Applicant(s)/Patent	unde
Reexaminat	ion	

MIYAMOTO ET AL.

Art Unit

2627

	SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

INT	INTERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
			-
<u> </u> -			

SEARCH N (INCLUDING SEAR)
	DATE	EXMR
east search, see print out	7/22/2007	JOC
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		